

積體電路可靠度設計 與測試關鍵技術研討會

Workshop of Reliability Design and Testing Technology of Integrated Circuit

研討會主旨

本研討會特別邀請到在靜電防護領域鑽研多年的交通大學柯明道教授，解析靜電防護對奈米積體電路的迫切性與新型全晶片靜電放電防護電路開發的技術，並同時邀請中山大學電機系系主任王朝欽教授、中興大學資工系王行健教授、高雄師範大學電子系吳建銘教授，分別講授多重電壓輸入輸出介面電路設計、低成本多點測試與測試輸出壓縮、射頻積體電路在無線系統的設計與實作以及封裝評估與印刷電路板效應等議題，幫助您迅速了解如何有效提高積體電路的可靠度、測試與封裝的關鍵技術及靜電防護未來的發展趨勢與不可或缺性

報名方式

請一律上網報名，網址：<http://vlsi.ee.nsysu.edu.tw/wshop09/>
TIEEE/T-ESDA/IEEE MTT-S Tainan Chapter 會員 800 元，
非會員 1200 元，學生 300 元

舉辦時間地點

2009 年 10 月 9 日 8:40 a.m ~ 17:00 p.m

國立中山大學圖資大樓 11F 會議室 (高雄市鼓山區蓮海路 70 號)

主辦單位



中山電機

協辦單位

經濟部

Do IT

經濟部技術處學界科專辦公室
Department of Industrial Technology

TIEEE



Organizing Committee

柯明道教授/國立交通大學

私立義守大學

王朝欽教授/國立中山大學

洪子聖教授/國立中山大學

吳建銘教授/國立高雄師範大學

王行健教授/國立中興大學

李淑敏教授/國立中山大學

Contact

陳姿文小姐 (07)525-4149

郭容齊小姐 (07)525-4149

Sponsor



<http://vlsi.ee.nsysu.edu.tw/wshop09>

積體電路可靠度設計與測試關鍵技術研討會

本研討會特別邀請到在靜電防護領域鑽研多年的義守大學柯明道副校長，解析靜電防護對奈米積體電路的迫切性與新型全晶片靜電放電防護電路開發的技術，並同時邀請中山大學電機系系主任王朝欽教授、中興大學資工系王行健教授、高雄師範大學電子系吳建銘教授，分別講授多重電壓輸入輸出介面電路設計、低成本多點測試與測試輸出壓縮、射頻積體電路在無線系統的設計與實作以及封裝評估與印刷電路板效應等議題，幫助您迅速了解如何有效提高積體電路的可靠度、測試與封裝的關鍵技術及靜電防護未來的發展趨勢與不可或缺性。



中山電機



Do IT

經濟部技術處學界科專辦公室
Department of Industrial Technology

- ✚ 主辦單位：國立中山大學工程技術研究推展中心、中山大學電機系
- ✚ 協辦單位：經濟部技術處學界科專辦公室、台灣電機電子工程學會(TIEEE)
- ✚ 時間：中華民國98年10月9日
- ✚ 地點：國立中山大學圖資大樓11樓會議室
- ✚ 報名方式：請一律上網報名
- ✚ 報名網址：[待補](#)
- ✚ 報名日期：即日起到10/2止
- ✚ 報名費用：TIEEE/T-ESDA/IEEE MTT-S Tainan Chapter會員800元，
非會員1200元，學生300元
- ✚ 繳費方式：1.郵政劃撥帳號為 42232310，戶名為「王朝欽」
2.會議當天以現金方式當場繳納
- ✚ 聯絡窗口：陳姿文 小姐 (07) 5254149、winnieof@vlsi.ee.nsysu.edu.tw
郭容齊 小姐 (07) 5254149、krchi@vlsi.ee.nsysu.edu.tw
- ✚ 其他說明與注意事項：
 1. 若有意加入TIEEE會員，請參閱網站 <http://www.tieee.org.tw> 或電洽 (07)5254149 陳小姐。
 2. 報名費用含紙本講義、午餐餐盒及茶水，收據將於會議當天發送。

3. 繳交之費用於研討會期前，如因主辦單位因素未能如期舉辦，將全數退還，如因學員個人因素無法參訓，退還三分之二；而若研討會期已開始，受訓學員不得要求退費。
4. 研討會期若遭遇颱風來襲，將依據高雄市政府人事行政局規定比照辦理。
5. 主辦單位保留議程及講師更改之權利。



活動議程：

積體電路可靠度設計與關鍵技術研討會		
地點	中山大學圖資大樓 11 樓會議室	
時間	議題	主講者
8:40~9:20	報到	
9:20~9:30	Opening Remarks	中山大學 王朝欽教授
9:30~10:40	積體電路與系統之靜電放電防護設計 (ESD Protection in Nanoscale CMOS Integrated Circuits)	義守大學 柯明道副校長
10:40~10:55	Coffee break	
10:55~12:00	低成本多點測試與測試輸出壓縮 (Low-cost multi-site test with test output compression)	中興大學 王行健教授
12:00~14:00	Lunch	
14:00~15:00	多重電壓輸出輸入介面電路設計 (Mixed-voltage Input/Output Interface circuit design)	中山大學 王朝欽教授
15:00~15:15	Coffee break	
15:15~16:45	無線系統之射頻積體電路設計與實作以及包含封裝與電路板效應之評估 (Design and Implementation of RFICs for Wireless Systems Including Evaluation of Package and PCB Effects)	高雄師範大學 吳建銘教授



贊助廠商：



翔·宇·科·技